リニアアレイ探触子を用いた鋼材内部のイメージング法について

愛媛大学大学院	学生員	松岡ちひろ
愛媛大学大学院	正会員	中畑和之
東京工業大学大学院	正会員	廣瀬壮一

1. 緒言

リニアアレイ探触子¹⁾ は独立に駆動できる複数の 小さな振動素子を直線状に配置し,これらを電子的 に制御することによって超音波の送受信を行う探触 子である.この探触子は従来のように機械的に走査 して探傷エコーを収集する必要がないため,広範囲 のエコーデータを短時間に得ることができる.

本研究では,2次元フーリエ変換を基本構造とした 周波数域開口合成法²⁾の理論を線形化逆散乱法³⁾に 応用した逆散乱イメージング法を提案し,これをア レイ探触子と組み合わせて用いる場合について検討 を行う.前半で,低周波数域の近似を導入したボルン 逆散乱イメージング法と,高周波数域の近似を導入 したキルヒホフ逆散乱イメージング法について述べ る.後半では,境界要素法によって数値的に計算し た欠陥エコーを逆散乱イメージング法に入力するこ とによって,欠陥の再構成シミュレーションを行う. この結果を基に,アレイ探触子の素子配置が欠陥像 の再構成性能におよぼす影響について報告する.

2. 逆散乱イメージング法

 $2 次元直交座標を <math>(x_1, x_2)$ とし,角振動数を ω とする時間調和な波動場を考えると,SH 波の運動を支配する面外の変位 u は次の運動方程式を満足する.

$$\mu[\Delta u(\boldsymbol{x},\omega) + k_T^2 u(\boldsymbol{x},\omega)] = 0 \tag{1}$$

ここで、 μ はせん断弾性係数、 $k_T (= \omega/c_T)$ は横波の 波数、 c_T は横波の波速である。本イメージング法で 対象とする超音波の送受信概要図を図-1 に示す.均 質等方な弾性体 D 内に散乱体 D^c が存在しているも のとする。ここで扱う逆散乱問題とは、アレイ探触子 y から u^{in} を送信し、散乱体 D^c によって散乱された



図-1 アレイ探触子による超音波送受信概要

u^{sc}を同じ位置で受信して,この散乱波形から逆に散 乱体の形状を推定しようとするものである.以下で は,散乱体 D^cを空洞欠陥と仮定し,本イメージング 法のキーとなる式のみ示すことにする.

(1) ボルン逆散乱イメージング法

ここでは,欠陥 D^c の領域内部において値を有する特性関数 $\Gamma(x)$ を定義する $^{(3)}$.ボルン近似を導入すれば,欠陥エコー \overline{u}^{sc} は

と表すことができる.ここで, $k_2 = \sqrt{4k_T^2 - k_1^2}$ である.上式の \overline{u}^{sc} は散乱波 u^{sc} を y_1 についてフーリエ変換したもの:

$$\overline{u}^{sc}(k_1, y_2, k_T) = \int_{-\infty}^{\infty} u^{sc}(y_1, y_2, k_T) \exp(-ik_1 y_1) dy_1 \quad (3)$$

である.式(2)は座標 (x_1, x_2) について2次元フーリ エ変換の構造を有するので,これをフーリエ逆変換 することによって特性関数 $\Gamma(x)$ を得る.

$$\Gamma(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iint_{-\infty}^{\infty} \frac{4\pi\sqrt{i\pi y_2}k_2 \overline{u}^{sc}}{\left(\frac{\sqrt{k_1^2 + k_2^2}}{2}\right)^{\frac{3}{2}} u^0 \exp\left(ik_2 y_2\right)} \\ \times \exp\left\{i\left(k_1 x_1 + k_2 x_2\right)\right\} dk_1 dk_2 \quad (4)$$

すなわち,欠陥エコーデータ \overline{u}^{sc} を用いて,式(4)を 数値的に実行することによって,欠陥の領域形状 $\Gamma(x)$ が再構成される.

(2) キルヒホフ逆散乱イメージング法

欠陥の境界部 S において値を有する特異関数 $\gamma(x)$ を定義する ³⁾. キルヒホフ近似を用いれば欠陥エコー \overline{u}^{sc} は次式のように表すことができる.

$$\overline{u}^{sc}(k_1, y_2, k_T) = \left(\frac{\sqrt{k_1^2 + k_2^2}}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \frac{iu^0 \exp(ik_2 y_2)}{4\pi \sqrt{i\pi y_2} k_2} \\ \times \iint_{-\infty}^{\infty} \gamma(\boldsymbol{x}) \exp\left\{-i\left(k_1 x_1 + k_2 x_2\right)\right\} dx_1 dx_2 \quad (5)$$

キーワード:超音波,逆散乱イメージング法,リニアアレイ探触子,形状再構成

〒 790-8577 松山市文京町 3, TEL: 089-927-9812, FAX: 089-927-9840, E-mail: nakahata@dpc.ehime-u.ac.jp

これを逆フーリエ変換すると,欠陥の境界形状 $\gamma(x)$ が再構成できる.

$$\gamma (\boldsymbol{x}) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iint_{-\infty}^{\infty} \frac{4\pi \sqrt{i\pi y_2} k_2 \overline{u}^{sc}}{\left(\frac{\sqrt{k_1^2 + k_2^2}}{2}\right)^{\frac{1}{2}} u^0 \exp(ik_2 y_2)} \\ \times \exp\left\{i \left(k_1 x_1 + k_2 x_2\right)\right\} dk_1 dk_2 \quad (6)$$

3. 欠陥像のイメージングシミュレーション

平らな表面をもつ被検体 (ステンレス鋼: $c_T=3100$ m/s, $\rho=7830$ kg/m³)の内部に欠陥が存 在する場合について,境界要素法によって得られ た波形データを用いて欠陥の再構成シミュレーショ ンを行った.ここでは,送信超音波の最高周波数 $f^{max}(=k_T^{max}c_T/2\pi)$ を2.39MHzとした.

4 つの円形空洞欠陥に対する再構成結果を図-2 に 示す. 左側は素子間隔 1.0mm,素子幅 0.8mm の計 64 個の素子をもつリニアアレイ探触子であり,右側は素 子数が倍の 128 個の素子をもつリニアアレイ探触子 である. ボルン逆散乱イメージング法によって欠陥 領域が,キルヒホフ逆散乱イメージング法によって欠陥 領域が,キルヒホフ逆散乱イメージング法によって 欠陥境界部が再構成されている. 被検体の片側表面 で超音波を送受信しているため,欠陥の上側部分が 再構成されているのがわかる. 64 個の素子を用いた 場合,空洞欠陥が横に細長く歪んでいるが,128 個の 素子を用いた場合にはほぼ半円状に表現されている. これは,素子数が増加すれば,欠陥の形状再構成に寄



図-2 4つの円形空洞欠陥の再構成



図-3 中心間距離 3mm の円形空洞欠陥の再構成図

与するデータが多く計測できるためであると考える. 次に,中心間距離が3mmの2つの円形空洞欠陥の

再構成を図-3 に示す.図-3の左側は素子間隔1.0mm, 素子幅0.8mmの計64個の素子をもつリニアアレイ 探触子であり,右側は素子数が計32個のリニアアレ イ探触子を用いたものである.図-3より,素子数が 多い場合には2つの欠陥形状が明確に分離して再構 成されているのがわかる.探触子の開口幅が大きい ほど,分解能も向上することがわかる.

4. 結論

本研究では,リニアアレイ探触子で得られる欠陥 エコーを基に鋼材内部の欠陥形状を再構成する逆散 乱イメージング法を提案し,その性能を数値シミュ レーションによって検証した.この結果,ボルン逆散 乱イメージング法は欠陥領域を,キルヒホフ逆散乱 イメージング法は欠陥境界部を再現することが示さ れた.欠陥形状を正確に再現するためには,開口幅の 大きなアレイ探触子を用いることが肝心であり,こ れは分解能の観点からも有効であることが示された.

参考文献

- 1) 小島 正: 非破壊検査, Vol.51, No.11, pp705-709, 2002.
- Nagai, K.: *IEEE Trans. Sonics Ultrason.*, Vol.SU-32, No.4, pp531-536, 1985.
- Kitahara, M., Nakahata, K. and Hirose, S.: Wave Motion, Vol.36, pp.443–455, 2002.